

第1回 設備利用講習会 —走査型プローブ顕微鏡による材料計測の基礎とノウハウ—

今年 7 月から新しく原子間力顕微鏡 (AFM) が利用できるようになりました。この装置は、一般的な汎用 AFM でできる測定に加えて、周波数変調方式による高分解能測定や、湿度や気温など制御された環境での測定が行える特徴があります。この設備利用講習会では、この装置の原理やどのような測定が可能かについての講習をし、実際に測定のデモンストレーションを行います。

日時: 2014年10月30日(木) 13:30-16:50
場所: 物質・材料研究機構(NIMS) 千現地区 第2会議室

<受付 13:00から>

<講演会13:30-15:30>

- 13:30-13:40 挨拶 微細構造解析プラットフォーム概要説明
藤田大介 (NIMS微細構造解析プラットフォーム運営責任者)
- 13:40-14:20 「走査型プローブ顕微鏡によるオペランド材料計測」
藤田大介 (NIMS微細構造解析プラットフォーム運営責任者)
- 14:20-15:30 「ナノテクノロジープラットフォーム共用設備 環境制御型周波数
変調方式走査型プローブ顕微鏡」
粉川良平 (株式会社 島津製作所)
1. FM-AFMとは
2. FM-AFMの応用例
3. 環境制御SPM/AFMの紹介と応用例

<ラボツアー15:40-16:50>

- 15:40-16:10 環境制御型周波数変調方式走査型プローブ顕微鏡 (FM-SPM)
- 16:20-16:30 走査型ヘリウムイオン顕微鏡 (ORION Plus)
- 16:40-16:50 極低温・高磁場走査型トンネル顕微鏡 (STM)

申込みはこちら: <http://www.nims.go.jp/nmcp>
お問合せ: NIMS微細構造解析プラットフォーム
<E-mail: nmcp@nims.go.jp>

